

ICS 77.120.99
H 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.1—2008
代替 GB/T 17473.1—1998

GB/T 17473.1—2008

微电子技术用贵金属浆料测试方法 固体含量测定

Test methods of precious metals pastes used for
microelectronics—Determination of solids content

中华人民共和国
国家标准
微电子技术用贵金属浆料测试方法
固体含量测定

GB/T 17473.1—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址: www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

*

书号: 155066·1-31520 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533



GB/T 17473.1—2008

2008-03-31 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

$$w = \frac{m_2 - m}{m_1 - m} \times 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中：

w ——浆料中固体的质量分数，%；

m ——坩埚或聚酯薄膜的质量，单位为克(g)；

m_1 ——坩埚或聚酯薄膜与试料加热前质量之和，单位为克(g)；

m_2 ——坩埚或聚酯薄膜与试料加热后质量之和，单位为克(g)。

7.2 测试结果表示至小数点后两位，有效数字的尾数按 GB/T 8170 数值修约规则进行。

7.3 取三份试料测试结果的算术平均值作为测定结果。

7.4 三份试料相互测试绝对值之差均不大于平均值的 1%测定结果有效，否则另取试样重新测定。

8 检测报告

检测报告应包括以下内容：

- a) 试样编号；
- b) 试样名称、牌号、规格；
- c) 产品批号；
- d) 测试结果及检测部门印章；
- e) 本标准编号；
- f) 测试人及测试日期。

前 言

本标准是对 GB/T 17473—1998《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法》(所有部分)的整合修订,分为 7 个部分：

- GB/T 17473.1—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 固体含量测定；
- GB/T 17473.2—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定；
- GB/T 17473.3—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 方阻测定；
- GB/T 17473.4—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 附着力测试；
- GB/T 17473.5—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 粘度测定；
- GB/T 17473.6—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 分辨率测定；
- GB/T 17473.7—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 可焊性、耐焊性测定。

本部分为 GB/T 17473—2008 的第 1 部分。

本部分代替 GB/T 17473.1—1998《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 固体含量测定》。

本部分与 GB/T 17473.1—1998 相比,主要有如下变动：

- 将原标准名称修改为微电子技术用贵金属浆料测试方法 固体含量测定；
- 删除了引用文件 GB/T 2421—1989；
- 本部分增加了聚合物低温固化型浆料的固体含量测定内容；
- 对于聚合物低温固化浆料,根据浆料使用温度的不同来确定检测固体含量的温度；
- 浆料平行取样由两份增加为三份；
- 删除了中温烧成浆料的内容,将高温烧成浆料改为烧结型浆料；
- 试料相互之间测试值之差均不大于平均值的 1%测定结果有效。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人：陈一、张骏、朱武勋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 17473.1—1998。